### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

08-240830

(43)Date of publication of application: 17.09.1996

(51)Int.Cl.

GO3B 5/00 G02B 23/18 HO4N 5/232

(21)Application number: 07-043006

(71)Applicant: CANON INC

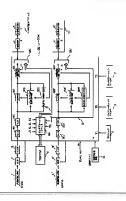
(22)Date of filing: 02.03.1995

MOROFUJI TAKESHI (72)Inventor:

(54) SHAKE CORRECTING DEVICE AND OPTICAL DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain an optimum driving characteristic and to correct the balance of the characteristic of each shake correcting means by correcting the lowering of the shake correcting characteristic of plural shake correcting means caused by environmental change and the change with time, and dispersion caused by an individual difference. CONSTITUTION: The shake correcting devices 30 and 30' consisting of a variable apex angle prism are respectively arranged in the right and left optical systems of binoculars. The shake correcting devices provided with a calibration function 207 detecting the offset of frequency characteristic, a driving limit range and an initial position respectively from response characteristic at the time of supplying a specified driving signal for a test to the devices 30 and 30' so that the offset may be corrected individually and performing correction for balancing so that the characteristic of the right and left shake correcting devices may be equal are mounted on the optical



LEGAL STATUS

systems.

[Date of request for examination]

01.03.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3683929

Date of registration

03.06.2005

[Number of appeal against examiner's decision of rejection] [Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection

[Date of extinction of right]

# (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-240830

(43)公開日 平成8年(1996)9月17日

(51) Int. C1. 6	識別記号	FI	
G03B 5/00		G03B 5/00	J
G02B 23/18		G02B 23/18	
HO4N 5/232		H04N 5/232	Z

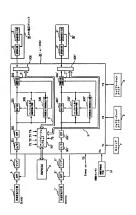
		審查請求	未請求	請求項の数9	OL	(全23頁)
(21)出願番号	特願平7-43006	(71)出願人	000001007			
(22)出顧日	平成7年(1995)3月2日	(72)発明者	東京都大田区下丸子3丁目30番2号 諸藤 剛 東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノ			
		(74)代理人	ン株式会 弁理士			

## (54) 【発明の名称】 ぶれ補正装置及び光学装置

#### (57) 【要約】

【目的】 複数のぶれ補正手段の環境変化、経時変化に よるぶれ補正特性の低下、個体差によるばらつきを補正 し、最適な駆動特性を得るとともに、各ぶれ補正手段の 特性のパランスを補正することにある。

【構成】 双眼鏡の左右の光学系に可変頂角プリズムからなるぶれ補正装置をそれぞれ配し、各ぶれ補正装置に 所定のテスト用駆動信号を供給したときの応答特性から、それぞれ周波数特性、駆動限界範囲、初期位置のオフセットを検出し、これを個々に補正するとともに、左右のぶれ補正装置の特性が等しくなるようにパランスをとるための補正を行うキャリプレーション機能207を備えたぶれ補正装置を搭載した双眼鏡。



【特許萧求の節用】

【請求項1】 ぶれによる画像の動きを補正する第1の 動き補下手段と.

ぶれによる画像の動きを補正する第2の動き補正手段 Ł.

所定の駆動信号に対する前記動き補正手段の応答特性 と、前記駆動信号に対する前記第2の動き補正手段の広 答特性をそれぞれ検出し、前記第1の動き補正手段の応 答特性と、前記第2の動き補正手段の応答特性が実質的 に等しくなるように、前記第1の動き補正手段及び前記 10 第2の動き補正手段の少なくとも一方の駆動特性を補正 する制御手段と、を備えたことを特徴とするぶれ補正装

【請求項2】 請求項1において、前配制御手段は、前 記駆動信号に対する前記第1及び第2の動き補正手段の 応答振幅及び位相ずれをそれぞれ検出し、咳応答振幅及 び位相ずれに応じて、前記第1及び第2の動き補正手段 の伝達周波数特性が実質的に等しくなるように補正する ように構成されていることを特徴とするぶれ補正装置。 【請求項3】 請求項2において、前記制御手段は、前 20 記駆動信号に対する前記第1及び第2動き補正手段の応

答振幅及び位相ずれを輸出し、該広答振幅及び位相ずれ に応じて、前記第1及び第2の動き検出手段の利得及び 位相を補正するように構成されていることを特徴とする ぶれ補正装置。

【請求項4】 請求項1において、前配制御手段は、前 記駆動信号に対する前記第1及び第2の動き補正手段の 駆動範囲を検出して所定の駆動範囲基準値に対するオフ セツトをそれぞれ演算し、該オフセツトに広じて前記第 うに構成されていることを特徴とするぶれ補正装置。

【請求項5】 請求項1において、前記駆動信号は前記 第1及び第2の動き補正手段を基準位置に位置させる信 号であり、前記制御手段は、前記第1及び第2の動き補 正手段の前記基準位置に対するオフセツトを検出し、該 オフセツトに応じて前記第1及び第2の動き補正手段の 初期位置を補正するように構成されていることを特徴と するぶれ補正装置。

【請求項6】 請求項1乃至5において、前記動き補正 手段は、可変頂角プリズムを含む光学的ぶれ補正手段で 40 あることを特徴とするぶれ補正装置。

【請求項7】 請求項1において、前記制御手段は、前 記駆動信号を発生する駆動信号発生手段と、前記駆動信 号に対する前記第1及び第2の動き補正手段の応答特性 を検出する特性検出手段とからなるキヤリブレーション 手段を有することを特徴とするぶれ補正装置。

【請求項8】 光学特性を可変するための可動部を有す る第1の光学系と、

前記第1の光学系を駆動する第1の駆動手段と、

と、 前記第2の光学系を駆動する第2の駆動手段と、

所定の駆動信号に対する前記第1及び第2の光学系の応 答特性をそれぞれ検出し、前記第1の光学系と前記第2 の光学系の応答特性が実質的に等しくなるように、前記 第1の駆動手段及び前記第2の駆動手段の少なくとも-方の駆動特性を補正する制御手段と、を備えたことを特 徴とする光学装置。

【請求項9】 請求項8において、前記制御手段は前記 第1及び第2の駆動手段の周波数特性、駆動範囲、初期 位置に関するオフセツトを検出し、該オフセツトを前記 第1の及び第2の駆動手段の少なくとも一方の駆動特性 を変更することによつて補正するように構成されている ことを特徴とする光学装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、銀塩カメラ、ビデオカ メラ等の撮影装置、あるいは双眼鏡等の光学機器等に用 いて好適な画像の振れ補正装置に関するものである。

[0002] 【従来の技術】従来より、銀塩カメラ、ビデオカメラ等 の撮影装置の分野では、露出設定、焦点調節等、あらゆ る点で自動化、多機能化が図られ、撮影環境に関わらず 常に良好な撮影を行うことができるようになっている。 【0003】しかしながら、実際に撮影画像の品位を著

しく低下させているのはカメラぶれであることが多く、 近年では、このカメラぶれを補正するぶれ補正装置が種 々提案され、注目を集めているところである。

【0004】 ぶれ補正装置は、補正系では光学的補正 1及び第2の動き補正手段の駆動限界範囲を補正するよ 30 と、画像処理による電気的補正とに、また検出系では物 理的な振動検出と、画像の動きベクトル等を用いた画像 処理による検出とに大別される。そしてこれらの組み合 わせの形態が種々提案されている。

> 【0005】いま光学的ぶれ補正を例にして説明する と、そのぶれ検出手段として例えば振動ジャイロ等の角 速度検出手段を備え、角速度センサから出力される速度 信号を積分して角変位信号に変換し、光軸方向を可変の 可変頂角プリズム等の光学的ぶれ補正手段を駆動してぶ れを光学的に補正する構成がとられている。

> 【0006】 このような光学的ぶれ補正装置は、通常ぶ れ補正を行うためのぶれ補正用コントロール信号によつ て可変頂角プリズムを駆動し、同時に可変頂角プリズム の角変位を検出してコントロール信号に対応した位置と なるまで駆動するようなフイードバツクループを有して いる。

#### [0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述の 可変頂角プリズムの様な光学的、機械的なぶれ補正手段 を用いるぶれ補正装置においては、特に機械的可動部分 光学特性を可変するための可動部を有する第2の光学系 50 の温度、経時変化により、軸摩擦、素子の変形等の機械

する)。

的劣化を伴い、比較的微小なぶれ(例えば光軸を微小 (後述の実施例では0.03deg程度)変位して偏光

する場合) に対し、制御上無視できないほどの応答(追 従)性の劣化が生じてしまう場合がある。また可変頂角 プリズム及びその駆動系の個体差も大きい。

【0008】これらの機械的な性能の低下、ばらつき は、サーボ機構により制御される可変頂角プリズム用い たぶれ補正装置においては、その制御上の中心位置が、 温度、経時劣化等の負荷変動の影響によりずれを生じる 不都合となる。

【0009】また可変頂角プリズムの駆動限界範囲が、 温度、経時による素子の変化あるいはバッテリーの消耗 により変動してしまう不都合を生じる。

【0010】また光軸調整時のばらつきが大きいため、 能力の高くない1チップ・マイクロコンピュータからの 出力信号のオフセットによる調整のみでは吸収しきれな い場合がある。

【0011】そこで本発明における課題は、上述の問題 点を解決し、ぶれ補正手段の温度、経時変化による、軸 正するとともに、駆動系の個体差によるばらつき等を補 正し、常に良好な応答特性を確保し得るようなぶれ補正 装置を提供するとともに、このようなぶれ補正装置を双 眼鏡のようの複数の光学系を有する光学装置に適用した 際、その光学系の前記応答特性のバランス調整を同時に 行うことにより、左右の特性の揃ったぶれ補正特性を有 する双眼鏡を提供することいある。

#### [0012]

【課題を解決するための手段】上述の課題を解決するた めに、本願の請求項1に記載された発明によれば、ぶれ 30 による画像の動きを補正する第1の動き補正手段 (実施 例では双眼鏡の右側光学系に配された右側VAP、ぶれ 補正プロツク30R,30R'及びマイコン20内の積 分手段203R, 203R'、位相/利得補正手段20 4 R、 2 0 4 R'にオその駆動系に相当する)と、ぶれ による画像の動きを補正する第2の動き補正手段と、所 定の駆動信号に対する前記動き補正手段の応答特件と、

(実施例では双眼鏡の左側光学系に配された左側VA P、ぶれ補正プロツク30L, 30L'及びマイコン2 0内の積分手段203L,203L'、位相/利得補正 40 手段204L、204L'にオその駆動系に相当する) と、前記駆動信号に対する前記第2の動き補正手段の応 答特性をそれぞれ検出し、前記第1の動き補正手段の応 答特性と、前記第2の動き補正手段の応答特性が実質的 に等しくなるように、前記第1の動き補正手段及び前記 第2の動き補正手段の少なくとも一方の駆動特性を補正 する制御手段(実施例ではマイコン20内のキヤリブレ ーションプロツク207に相当する)とを備えた構成と する。

れば、請求項1において、前記制御手段は、前記駆動信 号に対する前記第1及び第2の動き補正手段の応答振幅 及び位相ずれをそれぞれ検出し、該応答振幅及び位相ず れに応じて、前記第1及び第2の動き補正手段の伝達圏 波数特性が実質的に等しくなるように補正するように構 成する(実施例では、マイコン20によつて行われる図 4のステツプS5~S9の処理を左右のぶれ補正系につ いて行う処理に相当する)。

【0014】また本願の請求項3に記載された発明によ

10 れば、請求項2において、前記制御手段は、前記駆動信 号に対する前記第1及び第2動き補正手段の応答振幅及 び位相ずれを検出し、該応答振幅及び位相ずれに応じ て、前記第1及び第2の動き検出手段の利得及び位相を 補正するように構成する(実施例では、マイコン20に よつて行われる図4のフローチャートのステップS5~ S9の処理を左右のぶれ補正系について行う処理に相当

【0015】また本願の請求項4に記載された発明によ れば、請求項1において、前記制御手段は、前記駆動信 摩擦、素子の変形等の機械的劣化や、応答の遅れ等を補 20 号に対する前記第1及び第2の動き補正手段の駆動範囲 を給出して所定の駆動節囲基準値に対するオフセットを それぞれ演算し、該オフセツトに応じて前記第1及び第 2の動き補正手段の駆動限界範囲を補正するように構成 する (実施例ではマイコン20による図15のフローチ ヤートのステツプS209~S212までの処理に相当 する)。

> 【0016】また本願の請求項5に記載された発明によ れば、請求項1において、前記駆動信号は前記第1及び 第2の動き補正手段を基準位置に位置させる信号であ り、前記制御手段は、前記第1及び第2の動き補正手段 の前記基準位置に対するオフセツトを検出し、該オフセ ツトに応じて前記第1及び第2の動き補正手段の初期位 置を補正するように構成する(実施例ではマイコン20 による図15のフローチヤートのステツプS202~S 208までの処理に相当する)。

【0017】また本願の請求項6に記載された発明によ れば、請求項1乃至5において、前記動き補正手段は、 可変頂角プリズムを含む構成とした。

【0018】また本願の請求項7に記載された発明によ れば、請求項1において、前記制御手段は、前記駆動信 号を発生する駆動信号発生手段と、前記駆動信号に対す る前記第1及び第2の動き補正手段の応答特性を検出す る特性検出手段とからなるキヤリプレーション手段を有 する構成とした (実施例ではマイコン20内のキヤリブ レーションプロツク207の構成に相当する)。

【0019】また本願の請求項8に記載された発明によ れば、光学特性を可変するための可動部を有する第1の 光学系(実施例では双眼鏡の右側光学系に配された右側 VAPに相当する)と、前記第1の光学系を駆動する第 【0013】また本願の請求項2に記載された発明によ 50 1の駆動手段(実施例ではぶれ補正プロツク30R, 3

0 R' 及びマイコン2 0内の積分手段203R, 203 R'、位相/利得補正手段204R、204R'に相当 する)と、光学特性を可変するための可動部を有する第 2の光学系(実施例では双眼鏡の右側光学系に配された 右側VAPに相当する)と、前記第2の光学系を駆動す る第2の駆動手段(実施例ではぶれ補正プロツク30 L、30L、及びマイコン20内の積分手段203L. 203L'、位相/利得補正手段204L、204L' に相当する)と、所定の駆動信号に対する前記第1及び 第2の光学系の応答特性をそれぞれ検出し、前記第1の 10 光学系と前記第2の光学系の応答特性が実質的に等しく なるように、前記第1の駆動手段及び前記第2の駆動手 段の少なくとも一方の駆動特性を補正する制御手段 (実 施例ではマイコン20内のキヤリブレーションプロツク 207に相当する)とを備えた構成とする。

【0020】また本願の請求項9に記載された発明によ れば、請求項8において、前記制御手段は前記第1及び 第2の駆動手段の周波数特性、駆動範囲、初期位置に関 するオフセツトを検出し、該オフセツトを前記第1の及 び第2の駆動手段の少なくとも一方の駆動特性を変更す 20 範囲が最適値に互いにバランス良く補正される。 ることによつて補正する(実施例では、マイコン20に よつて行われる図4のステツプS5~S9の処理を左右 のぶれ補正系について行う処理、図15のフローチャー トのステツプS202~S212までの処理に相当す る) ように構成した。

[0021]

【作用】これによつて、本願の請求項1に記載の発明に よれば、第1及び第2の動き補正手段の応答特性を常に 等しく設定することができ、各動き補正手段の応答特件 のバランス調整を行うことができるとともに、温度、経 30 時変化による軸摩擦、素子の変形等の機械的誤差に起因 する特性変化が補正される。

【0022】また本願の請求項2、3に記載の発明によ れば、駆動信号に対する前記第1及び第2の動き補正手 段の応答振幅及び位相ずれを検出し、この応答振幅及び 位相ずれに応じて、前記各動き補正手段の利得及び位相 ずれがバランス良く補正される。

【0023】また本願の請求項4に記載の発明によれ ば、前記第1び第2の動き補正手段の駆動範囲基準値に 対するオフセツトが検出され、各動き補正手段の駆動限 40 界範囲が最適値にバランス良く補正される。

【0024】また本願の請求項5に記載の発明によれ ば、前記第1及び第2の動き補正手段の前記基準位置に 対するオフセツトが検出され、前記各動き補正手段の初 期位置が補正され、動き補正の偏りが補正され、前記第 1及び第2の動き補正手段のバランスをたもちながら、 且つその動き補正ダイナミツクレンジを広くとることが できる。

【0025】また本願の請求項6に記載された発明によ れば、可変頂角プリズムの温度、経時変化、素子の変形 50 A/D変換器、202は任意の帯域で特性を可変する機

等の機械的誤差による駆動特性の劣化及び変化が良好に 補正され、最適制御を図ることができる。

【0026】また本願の請求項7に記載された発明によ れば、キヤリブレーション動作によって任意に第1及び 第2の動き補正手段の応答特性を検出し、その各オフセ ツトを補正するとともに、第1及び第2の動き補正手段 のバランスを常に最適状態に保持することができるた め、経時変化や環境変化等によつて使用条件が変化して も常い最適状態で使用することができる。

【0027】また本額の請求項8に記載の発明によれ ば、第1及び第2の光学系の応答特性を常に等しく設定 することができ、各光学系の応答特性のバランス調整を 行うことができるとともに、温度、経時変化による軸摩 擦、素子の変形等の機械的誤差に起因する特性変化が補 正される。

【0028】また本願の請求項9に記載の発明によれ ば、駆動信号に対する前記第1及び第2の光学系、第1 及び第2の駆動手段の応答振幅及び位相ずれ、駆動範囲 基準値に対するオフセツト、各動き補正手段の駆動限界

[0029]

【実施例】以下、本発明を各図を参照しながらその実施 例について詳細に説明する。

【0030】 (第1の実施例) 図1は本発明におけるぶ れ補正装置をビデオカメラあるいはカメラ一体型VTR に適用した構成を示すブロツク図である。

【0031】同図において、1はカメラ等の撮影装置に 取り付けられた振動ジヤイロ等の角速度センサで、角速 度検出手段を構成する。2は角速度検出手段1から出力 される角速度信号の直流成分を遮断するDCカツトフィ ルタ(あるいは、任意の帯域で信号を遮断するハイパス ・フイルタ(以下、HPFと称す))、3は角速度信号 を適当な感度に増幅するアンプである。

【0032】20はアンプ3より出力された角速度信号 を入力して、後述のぶれ補正プロツク30内の画像補正 手段としての可変頂角プリズム (以下VAP:Variable angle prismと称す) を駆動するためのぶれ補正信号を 演算して出力する制御手段としてのマイクロコンピュー タ(以下マイコンと称す)であり、その内部構成はソフ トウエアによつて実現されるが、本実施例においては、 本発明を構成する手段及び機能を明瞭とするため、各機 能ごとにプロツクで示すことにする。

【0033】したがつて、マイコン20内の各種ブロツ ク以外の領域は、図示した各種プロツクと各種データ及 び指令の通信及び制御を行い、システム全体を総合的に 統括し制御するシステムコントロール部を示すものであ

【0034】マイコン20内において、201はアンプ 3より出力された角速度信号をデジタル信号に変換する 能を有するとともに位相補償の可能なHPFで、ぶれと して検出する周波数成分を通過させる。

【0035】203は角速度信号を積分してぶれ補正量 に相当する角変位信号に変換するための積分手段 (積分 器)、204は積分手段6の出力側に配され、角速度信 号を積分して角変位信号に変換してぶれ補正量を演算す る系の位相及び利得を補正する位相/利得補正手段を構 成する。

【0036】尚、位相/利得補正手段(回路)204内 には不図示のD/A変換器を備えており、アナログ出力 10 に変換して出力することができる。そしてこのD/Aの 出力にリミツタをかけてぶれ補正用のコントロール信号 の振幅を制限することにより、後述の可変頂角プリズム VAPの駆動範囲を制限して温度、経時変化等機械的な オフセツトを補正し、また双眼鏡の実施例においては、 左右のぶれ補正手段のバランス調節を行うことができ る。このような駆動範囲補正も制御データ線Cを介して 行うことができる。

【0037】30はマイコン20内の位相/利得補正手 段204より出力された、角変位信号に基づいて、その 20 ぶれによる画像の動きを補正するぶれ補正プロツクを示 し、その内部には、画像ぶれを補正する素子、機構及び これを駆動するアクチユエータ等からなる画像補正手段 5と、この画像補正手段5を駆動するための駆動手段と しての駆動回路4が設けられている。

[0038] 画像補正手段は、駆動回路4の出力にした がつてぶれによる画像の動きを補正するための駆動用ア クチユエータを含む可変頂角プリズム 5 が設けられてお り、これによつてぶれによる動きを打ち消す方向に光軸 を変位させることによつてぶれによる画像の動きを補正 30 するものである。

【0039】ここで再びマイコン20内の構成について 説明すると、205はパンニング、チルテイング及び撮 影状態を判別するパン/チルト判別手段(回路)、20 6は角速度信号よりぶれの間波数及び振幅を輸出する間 波数/振幅検知手段(回路)である。

【0040】このパン/チルト判別手段205は、HP F202からの角速度信号と、積分手段(積分器)20 3から出力された角変位信号を入力し、たとえば角速度 信号が一定で、角変位信号が一定の方向に単調増加ある 40 いは減少している場合に、パンニングあるいはチルテイ ングを判別することができる。

【0041】またこの判別の際に、同時に周波数/振幅 検知手段206によつて角速度信号及び角変位信号の振 幅及び周波数が検出され、ぶれ周波数が低く、振幅が一 方向に増加あるいは減少している場合に、パンニングあ るいはチルテイングを判別することができ、この情報は パン/チルト判別手段205へと供給される。

【0042】そしてパン/チルト判別手段205及び周 波数/振幅検知手段206によつてパンニング、チルテ 50 得補正手段204で行わずに、図1に点線で示すよう

イングが検出された場合には、積分手段の積分特性すな わち低域のカツトオフ間波数を高域側にシフトして低域 のぶれ補正機能を低下させ、パンニング及びチルテイン グ動作時の動き補正を低下させ、可変頂角プリズムの片 寄りを防止する。

[0043] また間波数/振幅検知手段206によつて ぶれの周波数を検出することにより、積分手段203の 周波数特性をぶれの中心周波数に設定することにより、 ぶれ周波数が変化しても、そのぶれ周波数に対して最大

のぶれ補正効果が得られるように動作させることがで き、ぶれの状態に対して最適ぶれ補正制御を行うことが できる。

[0044] また周波数/振幅検知手段206によつて 検出されたぶれの周波数及び振幅の情報は、位相/利得 補正手段204へと供給され、ぶれ周波数及び振幅に広 じて制御系の積分特性の周波数特性を変化させた際の位 相及び利得の補償を同時に行っているので、常に制御系 の安定性を保つことができ、いかなるぶれに対しても高 い補正能力を実現できるとともに、高精度かつ安定で信 頼性の高いシステムを実現することができる。

【0045】 このように、マイコン20内では、A/D 変換器201で、角速度信号(アンプ3出力)をデジタ ル値に変換し、積分手段203において、角変位信号に 変換する。

【0046】またパン/チルト判別手段205はA/D 変換器201後の角速度信号と積分手段203の出力す る角変位信号を用いたパン/チルト及び撮影状態の判別 手段を構成し、その判断結果に基づき、積分手段203 の周波数特性を上述のようにパンニング/チルテイング 時に高域側にシフトするように変更し、可変頂角プリズ ムのパンニング (チルテイング) 方向と逆方向の端への つき当たりを防止し、パンニング中でも高域側でのぶれ 補正を可能とする。

【0047】したがつて、ここでの積分手段203とし ては、低周波数域の遮断特性を有したものを想定してい る。

【0048】また周波数/振幅検知手段206は、角速 度信号(A/D変換器201の出力)と角変位信号(積 分手段203の出力)を入力とした周波数および振幅検 出手段であり、その検出周波数、検出振幅により、位相 /利得補正手段204において補正が行われる。

【0049】その補正が施された角変位信号が位相/利 得補正手段204内の不図示のD/A変換器によりアナ ログ値に変換され、あるいは、PWM等のパルス出力と してマイコン20から出力され、ぶれ補正プロツク30 内の駆動回路4へと供給され、VAPからなる画像補正 手段5が駆動される。これによつてぶれが抑制され、安 定した画像を得ることができる。

【0050】尚、上記位相及び利得の補正を、位相/利

に、HPF2の周波数特性を可変して行うこともでき る。

【0051】また7はぶれ補正機能の動作、非動作を選 択するISスイツチで、そのON/OFF状能は、デー 夕線T1によつてマイコン20内に取り込まれる。

【0052】また電源ONはpower on信号となつてデー 夕線 T5よりマイコン20内に取り込まれる。

【0053】また8はパツテリーの残量をチエツクする バツテリーチエツク動作を行うパツテリーチエツクスイ ツチで、その操作状能はデータ線下2によつてマイコン 10 20内に読み込まれる。

【0054】また9は後述する本発明の特徴部分である キヤリプレーション動作を行うためのキヤリブレーショ ンスイツチで、データ線T3によつてマイコン20内に 競み込まれる。

【0055】また10は、操作者(観察者)の眼が本発 明のビデオカメラの接眼部に近づいたことを検出して装 置を動作状態にするための観察者検知手段である。この 検知手段は、図12に示すように、たとえばビデオカメ ラあるいは双眼鏡等の接眼部130に投受光センサ13 20 て、VAP106によって入射角度が変えられた光束は 1を設け、赤外線を操作者の眼球EYEに照射し、その 反射光から眼球が近づいたことを知るような構成が用い られ、近年カメラのオートフオーカス用の測距領域等の 設定に用いられている視線検出装置によつて実現するこ とができる。またこの検知手段の状態はデータ線T4に よつてマイコン20内に読み込まれる。

【0056】そしてISスイツチのOFF→ONへの変 更時、あるいは電源投入時等に、HPF2 (あるいはH PF202)、積分回路203の特性(遮断周波数)を 可変制御する。

【0057】また、これらは、後述の記憶手段としての EEPROM6を用いて、可変頂角プリズム等の個体差 を吸収するため、任意の設定を行ったり、補正関数を変 更する事も可能である。

【0058】ここで、補正プロツク30内の画像補正手 段として用いられている光学的に光軸方向を変位させて ぶれを相殺するVAPすなわち可変頂角プリズムについ て説明する。

【0059】画像補正手段としてVAPを使用した場合 の構成例を図5に示す。これはプリズムの駆動にポイス 40 く異なってしまう(図にはないが低間波数帯域ではほぼ コイル型のモーターを使用し、プリズムの角変位をエン コーダにより検出して帰還をかける閉ループ制御の構成 としたものである。

【0060】図8に示すように、VAPは、対向した2 枚の透明平行板106a、106bの間に透明な高屈折 率 (屈折率 n) の弾性体または不活性液体 1 1 7 を狭持 し、その外周を樹脂フイルム等の封止材116にて強力 的に封止して成り、透明平行板106a、106bが揺 動可能に構成されている。

一方の透明平行板106aを揺動軸101(111)の 回りに角度 σ だけ回動させたときの入射光束 1 1 9 σ i過状態を示した図であり、同図に示すように、光軸34 3に沿って入射してきた光東119は楔形プリズムと同 じ原理により、角度 $\phi$ = (n-1)  $\sigma$ だけ偏向されて出 射する。即ち、光軸118は118aで示すように、角 度 φ だけ偏心 (偏向) される。

10

【0062】図11の説明に戻ると、以上、述べてきた VAP106を保持枠107を介して101, 111を 軸として回動し得るよう、鏡筒102に固定している。

【0063】113はヨーク、115はマグネツト、1 12はコイルであり、コイル112に電流を流すことに より111を中心としてVAPの頂角を可変し得る、ボ イスコイル型のアクチュエータとなっている。110は スリツトであり、回転軸111と同一に動く。

【0064】108は発光ダイオード、109はPSD (Position Sensing Detecto r) であり、110のスリットと合わせて、VAP頂角 の角変位を検出するエンコーダを構成している。そし

103のレンズによって104のCCD面上に結像す る。なお、105はもう片軸の中心軸を示している。

【0065】これらを用いた基本的な制御系の例を図6 にブロツク図で示す。

【0066】121はアンプ、122はドライバー、1 23はアクチュエータ、124はVAP、125はVA Pの頂角を検出する角変位エンコーダであり、ぶれ補正 用のコントロール信号120と角変位エンコーダ125 からの出力信号とが加算器126で逆極性で加算され

30 る。 【0067】したがSつて、コントロール信号120と 角変位エンコーダ125の出力信号とが等しくなるよう に制御が働くので、結果としてコントロール信号120 がエンコーダ125の出力と一致するように作用する。 【0068】しかしながら、実際は、図5、図6に示す

VAPユニツト (速度フィードパツク補償無し) の周波 数特性は、図10に示す程度のものであり、光軸をそれ ぞれ0.03deg偏光する場合と、0.1deg偏光 する場合とでは、その周波数特性(利得、位相)が大き 同一の応答を見せる)。

【0069】 すなわち、10Hzでは、0.1deg偏 光時に対し、0.03deg偏光時の位相が7deg遅 れてしまっている。

【0070】これは軸摩擦の影響、VAP素子の出来に 起因するもので、機械的改良等により解決されるのが好 ましいことではある。

【0071】しかし、上記によりぶれ補正性能上無視で きないほどの応答性の劣化が生じてしまうので、制御上 【0061】図9は、図8の可変頂角プリズム106の50の対策として、後述の図7のフローチャートで示すよう

に、ぶれ振幅に応じて適当な利得を設定し、機器に加わ る周期的ぶれの振幅により利得を変更する手段を用いて いる。

【0072】このような手法を駆使することにより、こ のように光軸の偏光を機械的駆動により行う機構を持つ ぶれ補正装置と現状の振動ジヤイロの特性を起因とし て、比較的不得意とする10Hz以上のぶれでも、良好 な補正が可能となっている。

[0073]実際には、位相進み補正の補正値により、 どのあたりの層波数に当てるかで補正効果は異なってく 10 る(10Hzに最適化可能である)が、手ぶれ補正を主 体に考えると(周波数適応制御を行わない場合)、10 H2以上の間波数に対する補正効果は低下してしまう。 【0074】ここで、上記のVAPを画像補正手段とし て用いた本実施例の制御系を、以下に説明すると、図1 のHPF202、積分手段203、位相/利得補正手段 204は、その特性をマイコン20内において実現する ためには、デジタル・フイルタを用いれば良く、この様 なデジタルフイルタには、例えば、図11に示す1次1 IRフイルタを使用するなら、

- $u0 = a0 \cdot w0 + a1 \cdot w1$
- w 0 = e 0+ a 2 · w 1
- w1 = w0 (w1は状態変数)
- e0 : 入力
- u0: 出力
- a0, a1, b1:フイルタ係数

の演算により実現でき、フイルタ係数 a 0 , a 1 , a 2 を変えることにより、周波数特性を設定できるので、対 応したフイルタ係数 a 0 、 a 1 、 a 2 のデータをテーブ ルタ係数で上記のIIRフイルタの演算を行えばよい。

【0075】そして、HPF202、積分手段203、 位相/利得補正手段204は、ここではデジタルフィル 夕等を使用して実現するので、サンブリング時間が比較 的高くなければならない (例えば1kHz以上) が、パ ン/チルト及び撮影状態の判別を行うパン/チルト判別 手段205、周波数/振幅検知手段206は比較的遅い 周期(例えば100Hz)の処理に設定すれば良い。

[0076]次に、この回路構成におけるマイコン20 ートにより説明する。

【0077】まず、図7 (a) は、VAP等の画像補正 手段を駆動制御するぶれ角変位信号演算に関するフロー チヤートである。

【0078】ステツプS100で処理を開始する。

【0079】ステツプS101でHPF2、アンプ3を 介して角速度検出手段1を構成する角速度センサからの 角速度信号をA/D変換器201によつてデジタル信号 に変換してマイコン20内部に取り込み、ストアする。 【0080】ステツプS102でHPF202の演算係 50 す。

数(図11の各フイルタ係数に相当する)を不図示のR OMよりロードする。

【0081】ステツプS103でステツプS101の入 力角速度信号に対してHPF演算を施し、直流成分、オ フセツト成分を除去する。

【0082】ステツプS104で積分手段203の積分 演算係数を不図示のROMより読み出してロードし、積 分手段203の特性を設定する。

【0083】ステップS105では、ステップS103 でHPF演算の施された角速度信号を積分回路203で 上記積分係数による積分演算を行い、角変位信号に変換

【0084】この際、前述したように、周波数/振幅検 知手段206によつて検出したぶれ周波数及び振幅に応 じたぶれ補正特性を積分手段203に持たせることがで き、ぶれ周波数に応じた最適のぶれ補正信号を得ること ができる。

【0085】ステツプS106でステツプS104で求 められた角変位信号をストアする。

【0086】ステツプS107で位相/利得補正手段2 20 04の位相及び利得補正係数をロードし、位相/利得補 正手段204の補正特性を決定し、制御系の特性に最適 な位相/利得補正を行う。

【0087】ステツブS108でステツブS105で得 られた角変位信号に、振動周波数・振幅、撮影状態の判 断に応じた補正演算を施し、ぶれ補正用のコントロール 信号を生成する。

【0088】具体的には、ぶれの中心周波数を検出して その周波数にぶれ補正手段のぶれ抑制力の周波数特性を ルとして用意し、そのテーブルを検索して得られるフイ 30 合わせる。これによつてそのぶれ周波数に対して効果的 にぶれ補正を行うことができる。

> 【0089】ステップS109では、ステップS108 で得られたコントロール信号を、位相/利得補正回路内 のD/A変換器(不図示)によりアナログ値に変換し、 あるいは、PWM等のパルス出力(不図示)としてマイ コン20より出力する。

【0090】ステツプS110では、後述の図10 (b) の処理において用いられる、振動周波数及び振幅 検出等の演算に使用する角速度信号に、ノイズが大きい の処理動作について、図7 (a), (b)のフローチヤ 40 場合に、そのノイズを除去するために、角速度信号にL PF演算を施す。

> 【0091】ステップS111では、ステップS110 で求めた角速度信号をストアし、次の動作に備える。 【0092】ステツプS112は、処理の終了を示すも のである。

> 【0093】次に、パン/チルト判別回路205及び周 波数/振幅検知手段206による振動周波数・振幅検 出、パン/チルト及び撮影状態の検知、各演算係数の設 定等に関する処理を、図7 (b) のフローチヤートに示

【0094】ステツブS113で、処理を開始する。 【0095】ステツブS114では、図7(a)のステップS111でストアされた角速度信号をロードする。 【0096】ステツブS115では、ステツブS106でストアされた角変位信号を読み出してロードする。 なお、ステツブS114、S115の順序は逆でもよい。 【0097】ステツブS116では、ステツブS114、S115の角速度信号。角変位信号を入力として、機器に加わっているぶれ中心周波数及び振幅を検出す

[0098] ぶれ振幅は、サーボ機構で駆動されるVA P等の画像補正装置で、微小な振幅でサーボ特性が低下 (追従振幅の減少すなわち不感帯内で追従できなくな る)したときの補正処理などに有効である。

[0099]例えば、サーボ機械により制御されるVA Pを用いたぶれ補正装置では、機械的構造、軸摩擦等に より比較的微小なぶれ (例えば0.03deg以下)に 対し、ぶれ補正性能上無視できないほどの応答性の劣化 が生じてしまうので、ぶれ振幅に応じて適当な利得を設 定し、機器に加わる周期的ぶれの振幅により利得を変更 20 する手段を用いている。

【0100】ステップS117では、ステップS114、S115の角速度信号、角変位信号、ステップS116で検出したぶれ中心周波数及び振幅を入力として、パン/チルト及び振影な状態の判断を行う。

[0101] ステツブS118では、パン/チルト及び 撮影状態の判断結果から、HPF演算係数及びの積分手 度の積分演算係数の設定を行う。すなわちパン/チルト 状態であつた場合には、積分手段の低域カットオフ周波 数を高域側にシフトし、低域のぶれに対する積分を抑制 30 する。これによつて直流分を含む超低域の振動 (パンニ ング/チルテイング) に対する補正が行われなくなり、 VAPの端へのつき当とりが妨止される。

[0102] また、ステツブS116で求められたぶれ 中心周波数、振幅により、周波数補正係数を設定する。 [0103] 以上の処理を行って、ステツブS119で 一連の処理を終了する。

[0104] なお、これらのパン/チルト及び撮影(観察) 状態に応じた係数は経験上求められ、予め用意されたデータ・テーブルを検索する。これに対して、周波数 40 補正係数は予め周波数毎に設定されたデータテーブルより検索される。そして図11で示すようなマイコン20 ないに形成されたデジタルフィルタの係数を変更して周波数特性を変更する。

【0105】しかしながら、上途のように、水柱補正プロツク30内において、画像補正手段5としての可変頂角プリズムを駆動するアクチュエータとしては、ポイスコイルモーダ等を使ったサーボ機様により駆動される頂角プリズム(光学的駆動手段)では、コントロール信号への追従性を向上させるために、サーボ制御の手法であ 50

る位相進み遅れ補償、速度フイードバック補償とループ ゲインの変更を用いて開波数特性の向上(追従性の向 上)が図られているが、機械的構造、精齢軽移等により比 較的微小なぶれ(例えば0.03deg以下)に対し、 ぶれ補正性能上無規できないほどの応答性の劣化が生じ てしまう。

【0106】そこで、ぶれ振幅に応じて適当な利得を設定し、機器に加わる周期的ぶれの振幅により利得を変更している。

10 [0107] しかしながら、上述のように、泡度や経時変化に起因した、結摩係、素子の変形等の機械的分化に より、比較的微小なぶれ(例えば0.03deg以下) に対し、性能上無視できないほどの応答(追従)性の劣 化が生じてしまう場合があるとともに、VAP間のばら つきも大きい。

[0108] またサーボ機構により制御されるVAPを 用いたぶれ補正装置においては、その制弾上の中心を置 が、温度、経等外化等の負別を動によりずれてしまうこ ともあり、またVAPの駆動限界範囲が、温度、経時に よる案子の変化、パツテリーの消耗によつて変動してし まう。

【0109】また光軸調整時のばらつきが大きいため、 1 チツプマイクロコンピユータからの出力信号のオフセ ツトによる調整のみでは、吸収しきれない場合がある。 【0110】これらの多くの問題を解決するために、本 発明の実施例によれば、以下に示すような、ぶれ補正特 性測定機能、キヤリブレーション機能を導入している。 【0111】 このキヤリプレーション機能は、マイコン 20内に設けられたキヤリブレーションブロック207 によつて実現され、このキヤリプレーションブロック2 07は、ぶれ補正プロツク30内の駆動回路4と制御及 びデータバスBによつて接続されて双方向に通信可能に 構成されており、駆動回路4へと画像補正手段5内の可 変頂角プリズムを任意の周波数及び振幅の基準駆動信号 で強制的に駆動するためのテスト信号を供給し、その応 答特性を受信して可変頂角プリズムのばらつき、経年変 化、各種特性のずれを補正する動作を行うものである。 【0112】またキヤリブレーションブロック207は VAPの応答特性を検出して、制御系の周波数特件(利 得、位相)を補正するため、位相/利得補正手段204 の周波数特性を変更する手段を有しており、その制御指 令は、バスBから分岐して位相/利得補正手段204へ と接続される制御データ線Cによつて供給される。これ によつてVAPの位相遅れ、利得の誤差が補正される。 【0113】またISスイツチ7、バツテリーチエック スイツチ8、キヤリブレーションスイツチ9、撮影者検 知手段10の操作状態を示すデータ線T1~T5は、キ ヤリブレーションプロツク207へと供給されており、 これらの信号に応じてキヤリブレーション動作を行うこ

とが可能である。

【0114】またいずれのスイツチに応じてキャリブレ ーションを行うかは、自由に設定することができる。詳 細は後述する。

【0115】キヤリプレーションプロツクは、VAPを 任意の周波数及び振幅で駆動し、基準駆動信号に対する 応答振幅及び位相ずれを検出し、その応答振幅及び位相 ずれに応じ、制御データ線Cを用いて補正係数を位相及 び利得補正手段204へと送信し、その周波数特性を変 更し、利得、位相ずれを補正する。

[0116] この基準駆動信号は、予めマイコン内蔵R 10 OMに波形を書き込んでおき、測定時に読み出して使用 し、同じく内蔵のA/D変換器を使って応答波形を取り 込み、基準信号との比較により周波数特性を求めれば良 い。よって、キヤリプレーション機能の追加による素子 の増加を伴うことは無い。

【0117】尚、図1から明らかなように、ぶれ検出系 及びぶれ補正系は、YAW方向と、PITCH方向の2 系統が設けられており、それぞれ独立してぶれを検出 し、補正する動作を行うが、補正するぶれの方向が異な るだけで、その制御系の構成自体は全く同一でよい。 【0118】したがつて、本実施例では、YAW方向の ぶれ補正系についてのみ説明し、PITCH方向につい

ては、YAW方向の構成に対応させて各構成要素に符号 を付し、符号にダツシュ 『 ' 』をつけて図示し、説明 は省略する。

【0119】またYAW方向とPITCH方向とで、面 像補正手段を別個に設けているが、VAP等のぶれ補正 手段はもちろん共通のもので、各ぶれ補正方向に対し、 VAP駆動用のアクチユエータが別個に設けられている ことは言うまでもない。

【0120】またさらに図13、図14に示すような双 眼鏡に本発明を適用した場合には、VAPを含むぶれ補 正系を左右で2系統備えているため、図1のYAW方 向、PITCH方向いおけるぶれ補正系がもう1組設け られているが、構成自体は同一であるため、図示及び説 明を省略し、図18にその概略のみ図示し、後述する。

[0121] また図1において、208は通常のぶれ補 正動作を行う場合には、位相/利得補正手段204の出 力をぶれ補正プロツク30へと供給し、後述のキャリプ レーション動作を行う場合は、キヤリブレーションプロ 40 ツク207より出力される駆動波形をぶれ補正プロツク 30へと供給すべく、バスBをぶれ補正プロツクに接続 するよう、各種制御及びデータ線を切り換える切換プロ ツクである。この切換プロツク28がぶれ補正プロツク 30に対する入出力ポートとなる。

【0122】図2に、特性測定、キヤリブレーション動 作を行うキヤリプレーションプロツク207及びぶれ補 正プロツク30内の駆動回路4の内部構成及び接続関係 をブロツク図で示す。

【0123】キヤリブレーションブロツク207内の機 50 変位ループが機成されている。

成について見ると、ROM207aには予めテスト用の VAP駆動波形が記憶されており、駆動信号発生回路2 07bは、ROM207aよりVAP駆動波形を読み出 して、所定の周波数及び振幅のVAP駆動波形をパスB を介して駆動回路4へと出力する。またこのテスト用V AP駆動波形は後述のオフセツト補正回路207cにも 供給される。

【0124】207cは駆動信号発生回路207bによ つて発生されたテスト用VAP駆動波形に対するVAP の実際の応答特性を検出する周波数特性検出手段と、V AP駆動波形とその応答特性とを比較してその制御系の 位相、周波数のずれ、VAPの光軸中心のずれ、VAP の駆動範囲のずれ等を検出し、これらのオフセツトを補 正するオフセツト補正手段からなるオフセツト補正回路

【0125】またオフセツト補正回路207cは、VA Pの駆動系の周波数、位相特性を検出した結果をEEP ROM6に記憶し、またその記憶した特性すなわちオフ セツト情報を次回の使用の際に読み出して、VAP駆動 20 回路の特性を補正し、常にVAPが最適な特性で駆動さ れるように制御する。

【0126】またオフセツト補正回路207cは、テス ト用VAP駆動信号と、これに対する実際のVAPの応 答信号を角変位エンコーダ4eより読み込み、図3で見 て振動波形の中心が 0 レベルからオフセツトしていた場 合には、テスト用VAP駆動信号とVAPの応答波形の 振動の中心となる基準レベル (0 レベル) が築しくなる ように、テスト用VAP駆動信号のレベルをシフトさせ るよう、そのオフセツト畳の情報を駆動信号発生手段2 30 07 bへと供給する。

【0127】これによつて、図3において、テスト用V AP駆動波形と応答波形との位相遅れを正確に検知する ことができる。

[0128] このEEPROM 6内の記憶値は、キヤリ ブレーション動作を行う度に更新されるため、経時変化 や温度変化等の環境変化に際しても最適の駆動状態を得 ることができる。また製造時から変化しない情報は、変 更を要しない。

【0129】一方、駆動回路4内の構成について見る と、4 a は位相補償回路、4 b はアンプ、4 c は画像補 正手段5としてのVAPを駆動するためのドライバーで ある。

【0130】4dはVAPの角速度を検出する角速度工 ンコーダであり、この角速度を図の様にアンプ4の入力 側に加算器4hによつてフイードバツクすることで速度 フイードバツク補償を行っている。

【0131】4eは画像補正手段5としてのVAPの移 動量を検出する角変位エンコーダであり、図のように位 相遅れ進み補償同路4aの入力側にフイードバツクし、

【0132】この角変位エンコーダ4eの出力値のオフ セツト調整、D/A変換器25により角変位エンコーダ 4 e にバイアスを与えることにより、VAPの預角変位

を変更し、光軸ずれを補正することができる。 【0133】また角変位エンコーダ4eの出力は、キヤ

リブレーションブロツク207内のオフセツト補正回路 207cへと供給され、角変位エンコーダ4eから供給 された信号と、VAP駆動波形とを比較し、駆動回路4 を含むVAPの周波数特性を演算し、かつ光軸のオフセ ツトを補正する。この光軸補正はD/A変換器4fを介 10 信号を出力する。初期調整では、この時VAPの偏光が して角変位エンコーダ4 e にバイアスを与えることによ つて頂角を可変して行う。EEPROM6はこれらの調 整値すなわちオフセツト情報を記憶する。

【0134】図3に位相遅れの測定方法の一例を示す。 まずキヤリブレーションブロック207より出力される テスト用のVAP駆動波形 (疑似ぶれ信号) に対するV AP応答波形のオフセツトをキャンセルする。

【0135】図3に示すように、疑似ぶれ信号及びVA P応答波形各々の中心値とクロスするタイミングの時間 差tnを測定し、設定期間Tでの平均により算出する。 【0136】また、特性測定、キヤリブレーションを行 うタイミングとしては、単独で専用スイツチ (キヤリブ レーションスイツチ9)を設け、任意の時刻にキヤリブ レーションを行うようにすることができる他、観察者検 知手段10のように、図12に示すような投受光センサ 131で眼球EYEの反射を検出して撮像動作が行われ ようとしていることを検出する視線検知手段等を使用し て観察者が覗いているか否かを判断し、観察者が覗かず に、ISスイツチ7、パツテリーチエツクスイツチ8が 押された場合に、キヤリブレーションを開始し、該応答 30 振幅及び位相ずれの輸出を行うことが考えられる。

【0137】すなわち観察者が撮影あるいは被写体を見 ている状態ではキヤリブレーションは行わず、観察者が 見ていないときに行うようにすることにより、不自然な 画像を見ることを防止している。

【0138】次に、この実施例における特性測定、キヤ リプレーション動作時のマイコン20の処理について、 図2のフローチヤートにより説明する。これはキヤリブ レーション用に専用のON/OFFスイツチ(キヤリブ レーションスイツチ9) を用いずにキヤリブレーション 40 相遅れを求める。 を行っている例である。

【0139】ステツブ200で処理を開始する。

【0140】ステツブ201では、ISスイツチ7の状 態が検出され、ONであれば次のステップ202へ進 380

【0141】ステツプ202では、観察者検知手段(接 眼部センサー) 10により、操作者(観察者)によりフ アインダの観察が行われているか否かを判断し、観察が 行われていれば、ステツプ211に示す通常のぶれ補正 動作ルーチンに移行する。観察が行われていなければ、

ステツブ203へと移行して、キヤリブレーション動作 が実行される。

【0142】ここで、誤操作等により、ある一定時間内 に何回もキヤリブレーション動作を行わないように、2 回目以降はステツプ203へと移行せずに、ステツプ2 01へと復帰するように構成してもよい。

【0143】ステツプ203では、マイコン20内のキ ヤリブレーションブロック207より、VAPの光軸が 撮像系の光軸と一致するようなVAPセンター基準保持 光学中心となっているが、図5に示すような、サーボ機 構により制御されるVAPでは、温度、経時変化による 軸摩擦、素子の変形等の機械的劣化等を主要因として、 実際には制御位置がずれてしまう。

【0144】これによりVAPをその光軸中心に位置さ せるセンター基準位置保持信号を加えた場合、光東が光 学中心から偏光した状態となる。

【0145】ステツプ204は、光学偏光のオフセツト 補正を行う処理である。すなわち、上記の現象に対応す 20 るため、頂角センサーの出力が、初期調整で得た光学中 心位置の記憶値となるようにように、VAPセンター基 準保持信号にオフセツトを加え補正する。この補正オフ セツト値をEEPROM6等に記憶する。

【0146】ステツブ205では、マイコン20内のキ ヤリプレーションプロツク207より疑似駆動波形を出 カする。

【0147】この時、疑似駆動波形をキヤリプレーショ ンプロツク207内のROM207a上に記憶しておく ことにより、種々の駆動波形 (振幅、周波数)を設定可 能である。

【0148】ステツブ206では、VAPの頂角変位を 検出する角変位エンコーダ4eから出力された角変位信 号をバスBを介してA/D変換器(オフセツト補正回路 2.07eに内蔵) によりオフセツト補正同路2.07e内 部に取り込む。

【0149】ステツプ207では、駆動波形発生回路2 07bより供給したVAP駆動波形 (疑似駆動波形) と、これに対するVAPの応答波形とを比較し、図3で 説明したように、応答特性のずれ、すなわち利得及び位

【0150】ステツプ208では、ステツプ207で検 出されたVAPの応答特性すなわち周波数特性を演算 し、その演算結果から、最適な補正パラメータ(周波数 特性補正係数) を予め用意された複数の周波数補正係数 を格納したデータテーブルより遊びだす。

【0151】ステツプ209では、その周波数補正係数 をEEPROM6等に記憶する。すなわち通常のぶれ補 正動作のルーチンにおいては、前記EEPROM6内に 記憶された補正パラメータ (データテーブル) を用いて 50 制御され、機械的誤差、素子自体の経時変化があつて

も、その誤差を補正して最適な特性で動作させることが できる。

【0152】ステツプ210でキャリブレーション動作 を終了し、処理を終わる。

【0153】上述のキヤリブレーション動作において、 VAP駆動波形(疑似駆動波形)の測定周波数及び振幅 は任意に設定可能であるが、特性を認識するのに代表的 な周波数、振幅にしたがつて、1,2点測定すれば良

い。例えば、図10に示す程度の特性であれば、10H z、±0.1degでの測定により補正パラメータを選 10 べば良いであろう。

【0154】以上の構成により、温度、経時変化によ る、軸摩擦、索子の変形等の機械的劣化に対応した、最 適なぶれ補正 (適応制御) が可能となる。

【0155】(第2の実施例)以上は、主に周波数特性 に関するキャリプレーション手段であるが、この他、駅 動範囲に対するキヤリブレーションも有効である。

【0156】すなわちVAP素子等の、温度、経時劣化 により、駆動範囲 (偏光可能範囲) が初期状態と比べ、 狭まってしまう場合があるからである。これは、VAP 20 示すプロツク図である。同図において、右側光学系につ ユニツトを単一で使用する場合においては、ぶれ補正節 囲の低下が主間顕となるが、特に以下に示すような複数 組のVAPユニットを使用する双眼鏡では、左右の光学 系の間で観察視野の違い等を引き起こし、観察者に不快 感を与えかねなくなる。

【0157】まず独立した2組以上の画優補正手段を有 する光学機器の一例として、図13に、左右独立した2 組の可変頂角プリズムユニツトを内蔵した双眼鏡の斜視 図を示す。

1L, 401Rは対物レンズユニツト、402L, 40 2 R は双眼鏡本体 4 0 0 に設けられた一対の接眼プリズ ムユニツト本体である。

【0159】また、対物レンズユニツト401L、40 1 R との間には視度・フォーカス調整機構 4 0 3 が設け られている。

【0160】また404はフォーカス調整リング、40 5は視度調整リングである。

【0161】そして、双眼鏡本体200には垂直方向の ぶれを検出するぶれ検出センサ、水平方向のぶれを検出 40 する検出センサが固定されている。

【0162】また、7はぶれ補正の動作・非動作を操作 する補正操作スイツチであり、例えば、押圧により操作 される.

【0163】ここで、ぶれ補正装置の双眼鏡への配置例 について図 1 4 に示す。301はフォーカスレンズを含 む対物レンズ群、302LはVAPユニツト、303は 正立プリズム、304は接眼レンズ群、306は制御回 路基板、305はぶれ補正装置に電力を供給するパツテ リーである。

[0164] VAPユニット302L、302Rはレイ アウト上、機械構造的に、対称に配置されている。つま り、構造的に、左右の惯性力が異なってしまう場合があ

20

【0165】以下にマイコン20によるキヤリブレーシ ヨン動作を説明するが、本実施例は、双眼鏡であり、図 1に示すようなYAW、PITCH方向のぶれ補正プロ ツクを左右2組備えている。

【0166】 したがつて、前述の第1の実施例に示すよ うなぶれ補正系が単独 (VAP単体のキヤリブレーショ ン) の場合だけでなく、左右のぶれ補正系のパランス間 節が重要である。

【0 1 6 7】 図 1 では、単一のぶれ検出補正系しか記載 していないが、マイコン20内には、図1に示す単一の ぶれ検出補正系がもう1系統設けられており、それぞれ 双眼鏡の左右のぶれ検出補正系を構成している。そして この左右のバランス調節もマイコン20によつて行われ **Z**.

【0168】図18は双眼鏡のぶれ検出補正系の概念を いて見ると、1R, 1R'はそれぞれYAW、PITC H方向の角速度検出手段、30R、30R'はそれぞれ YAW、PITCH方向のぶれ補正プロツクで、右側V APに接続されている。

【0169】またマイコン20内では、それぞれYA W、PITCH方向の積分手段203R, 203R'、 それぞれYAW、PITCH方向の位相/利得補正手段 204R, 204R'が設けられている。

【0170】また左側光学系について見ると、YAW、 【0158】同図において、400は双眼鏡本体、40 30 PITCH方向の角速度検出手段1L,1L'は、右側 光学系の角速度検出手段1R、1R'と兼用されてい る。これによつて左右の光学系に対し、左右でばらつく ことなく同じ角速度信号を供給することができる。30 L、30L'はそれぞれYAW、PITCH方向のぶれ 補正プロツクで、左側VAPに接続されている。

> 【0171】またマイコン20内では、それぞれYA W、PITCH方向の積分手段203L, 203L'、 それぞれYAW、PITCH方向の位相/利得補正手段 204L、204L'が設けられている。

【0172】またキヤリブレーションブロック207は それぞれ、右側ぶれ補正系のYAW、PITCH方向の キヤリプレーション及び左側ぶれ補正系のYAW、PI TCH方向のキヤリプレーションを行い、これらの各キ ヤリプレーション動作におけるテスト用駆動信号及び通 常ぶれ補正動作時における位相/利得補正手段204 R、204R'、204L、204L'の出力はそれぞ れ切換プロツク208でその動作モードに応じて適宜切 換られ、ぶれ補正プロツクへと供給される。

【0173】またEEPROM6も、これらの計4系統 50 のオフセツト情報を記憶している。

【0174】マイコン20は、このように左右の光学系 それぞれについてYAW、PITCH方向の位相及び利 得の周波数特性のずれ、駆動範囲の基準値からのずれ、 初期位置(基準位置)からのずれ当からなるオフセット 情報を検出して、そのオフセツト情報の補正を行うこと により、左右のぶれ検出補正系個々の駆動特性の補正及 び左右のバランス調整を行うものである。

【0175】以下、本第2の実施例における特性測定、 キヤリブレーション動作時のマイコン上の処理につい て、図15のフローチヤートにより説明する。ここで は、電源投入用のスイツチ、キヤリブレーションモード を指示するスイツチを有するものとする。

【0176】尚、VAPの制御及び駆動系については、 図1、図4の回路構成と同様であり、マイコン20によ つて処理が実行される。

【0177】処理をスタートし、ステツプS200にお いて電源投入がなされると、ステツプS201へと移行 し、観察者検知センサー10により、撮影者による観察 が行われているか否か、すなわち撮影者がフアインダを 見ているか否かを判断する。

【0178】そして観察が行われていれば次のステツブ S202へ進み、通常のぶれ補正動作が行われ、ステツ プS201へと戻る。

【0179】ステツプS201で観察が行われていなけ ればステツプS203へ進み、キヤリブレーションスイ ツチ9の状態を検出し、ONであれば次のステツプS2 04へ進み、OFFであればステップS205へ進む。 【0180】ステツプS204では、キヤリブレーショ

ン終了フラグの状態により、キヤリブレーション動作が 終了しているか否かの判別が行われ、キヤリブレーショ 30 ン動作が終了していれば、ステツプS205へと移行し て、VAP駆動系の補正動作を停止(VAPをメカ的に 固定) し、ステツブS201へと戻る。これによつて無 駄に補正動作(VAP駆動)を行うことがなく節電効果 がある。

【0181】またステツプS204で、キヤリブレーシ ヨン終了フラグが立っておらず、キヤリブレーション動 作が終了していなければS206へ進む。

【0182】ステップS206では、マイコン20のキ ヤリプレーションプロツクより、VAPセンター基準保 40 設定すれば効果が得られる。 持信号を出力し、上述の第1の実施例における図4で説 明したキヤリブレーション動作と同様に、ステツプS2 07で、左側のVAP区同形の光学偏光オフセツト補正 が行われる。これによつて左側VAPの光軸補正が行わ れる。

【0183】続いてステツプS208で、左側と同様に 右側の光学偏光オフセツト補正が行われる。これによつ て右側VAPの光軸補正が行われ、左右のVAPの光軸 オフセツト補正が完了する。

キヤリプレーションプロツク207よりVAP駆動波形 (疑似駆動波形)を出力しVAPの可動範囲の確認が行 われる。ここではVAPの可動節囲を確認するためのも のであるので、通常のVAPの可動範囲よりも大きな振 幅の信号を出力する。

【0185】ステツプS210では、VAP預角変位を 検出する角変位エンコーダ4eからの角変位信号をA/ D 変換器により内部に取り込む。

【0186】ステツプS211では、駆動波形と応答波 10 形との比較をし、左右のVAP駆動系各々の可動範囲を 測定する。

[0187] ステツプS212では、ステツプS211 で得られた結果から、VAPの駆動範囲を設定し、左右 のVAPの駆動範囲が同じくなるように補正が行われ

る。尚、この左右のVAP駆動系それぞれのオフセツト 補正量は、EEPROM6等に記憶され、次回のデフォ ルト値とする。

【0188】尚、この場合のVAPの駆動範囲設定は、 図10に示すような特性を、左右同一視野の保たれる範 20 囲で行われなければならない。すなわち左右のVAPが 同じ特性(駆動限界範囲、初期状態の光軸センターとな る基準位置で、同じ応答特性を有する範囲) で動作する ように構成されている。

[0189] VAPの駆動範囲の設定(補正)は、図1 において、位相/利得補正手段204、204'に制御 データ線Cを用いてオフセツト情報を供給し、D/A変 換器にリミツタを設けてダイナミツクレンジを制限し、 ぶれ補正用コントロール信号の振幅に制限を加えること によつて実現される。

【0190】そしてこの左右のVAPの可動範囲の小さ い方のVAPの可動範囲よりもさらに小さい範囲に駆動 限界範囲を設定する。これによつて左右のVAPをバラ ンス良く、さらに可動範囲に余裕を持たせることによつ て、安定な駆動を行うことができる。

【0191】以上でキヤリブレーション動作を終了し、 ステツプS213で、キヤリブレーション終了フラグを セツトし、ステツプS201へ戻る。

【0192】実際の適用においては、YAW、PITC H独立(片方を中心付近に固定)に、左右の駆動節囲を

【0193】このように、本実施例では、温度、経時変 化による、軸摩擦、素子の変形等の機械的劣化に対応し た、最適なぶれ補正(適応制御)が可能となり、特にぶ れ補正光学系を複数有する双眼鏡のような光学系におい て、個々のぶれ補正系のみならず、左右の補正系のバラ ンス調整をも同時に行うことができる。

【0194】 (第3の実施例) 次に、本発明における第 3の実施例について説明する。

【0195】サーボ機構により制御されるVAPユニツ 【0184】ステツブS209では、マイコン20内の50トを用いたぶれ補正装置では、温度、経時変化、姿勢差 による、軸摩擦、素子の変形等の機械的劣化により、基 準位置保持信号を加えた場合の光束の偏光が、期待され るもの(初期状態)に対し、オフセツトを持つ。

【0196】これは、単体使用では問題にならないレベ ルであっても、双眼鏡用として2組で使用する場合に は、光軸のズレが観察者に不快感を与え兼ねなくなる。 【0197】そこで、本実施例では、キヤリプレーショ

ン時はもちろんのこと、特にぶれ補正動作中に、明らか に左右各々の信号がオフセツトを生じている場合に、左 右の信号が一致するように補正を行うことを可能とした 10 は、光軸のズレが観察者に不快感を与え兼ねなくなる。 ものである。

【0198】つまり、IS動作中、良好な追従性の確保 される低周波数域において、ぶれ制御信号に対するVA Pの左右各々の頂角センサ出力が、ぶれ制御信号に対 し、一定の変位差を保って推移している場合には、オフ セツトを徐々に変更し補正を行う。

【0199】本実施例においても、VAP制御系の構成 自体は、図1、図4と同様であるため、その説明は省略 する。

【0200】次に、この実施例におけるマイコンで実行 20 される処理について、図16のフローチヤートにより説

【0201】図16のフローチヤートの処理は、通常の ぶれ補正動作中に実行可能であり、ステップS300 は、ぶれ補正動作中であることを示す。

【0202】ステツプS301において、オフセツト調 整フラグの状態により、オフセツト調整中であるか否か が判別され、オフセツト調整中であれば、ステツプS3 0.4へと移行して調整動作を行い、調整中でなければス テツプS302へと移行する。

[0203] ステツプS302では、マイコン20より ぶれ補正プロツク30内のVAP駆動回路4へと供給さ れるぶれ補正を行うためのVAP駆動信号aと角変位工 ンコーダ4eから出力された頂角変位センサ信号bを比 較し、初期状態と比較して、その変位量の差が予め求め られている平均的な設定値cより大きければステツプS 303へ、小さければステツプS300へ戻る。

【0204】ステツプS303では、オフセツト調整フ ラグをセツトし、ステツプS304で前記の | a - b | が小さくなるように、オフセツト調整を行う。すなわち 40 変位量の差が小さくなるように、所定値だけオフセット 出力を変更する(後述するが、オフセツト出力の補正に は、専用の調整機構を使用する方法と、マイコン20か ら出力するVAP駆動信号にオフセツトを加える方法と がある)。

【0205】ステツプS305では、VAP駆動信号と 頂角センサ信号の変位差が0であるかを調べ、0であれ ば次のステツプS306へ進み、0でなければステツブ S300へ戻る。

【0206】ステツプS306では、オフセツト調整フ 50 精度のオフセツト調整が行えるようになる。

ラグをリセツトしてオフセツト調整を終了し、ステツブ S300へ戻る。

【0207】サーボ機構により制御されるVAPユニツ トを用いたぶれ補正装置では、温度、経時変化、姿勢差 による、軸摩擦、素子の変形等の機械的劣化により、基 準位置保持信号を加えた場合の光束の偏光が、期待され るものに対し、オフセツトを持つ。

【0208】これは、単体使用では問題にならないレベ ルであっても、双眼鏡用として2組で使用する場合に

【0209】そこで、本実施例では、キヤリプレーショ ン時はもちろん、ぶれ補正動作中に、明らかに左右各々 の信号がオフセツトを生じている場合に、左右の信号が 一致するように補正を行う。これにより、左右光軸の一 致した良好な観察が可能となる。特に通常のぶれ補正動 作時においてこのオフセツト調整を可能としたので、キ ヤリブレーション動作を意識させることがなく、操作性 が格段に向上するとともに、画像に違和感がなく、常に 正確な観察を行うことができる。

【0210】(第4の実施例)以下に本発明の第4の実 施例について説明する。図14に示すような2組のVA Pユニツトを内蔵した双眼鏡では、VAPユニツト30 2L. 302Rはレイアウト上、機械構造的に、対称に 配置されている。

【0211】つまり、構造的に、左右の慣性力が異な る。また、上述のVAPユニツトにおいては、角変位検 出素子の取付誤差により、VAPの光軸中心位置に対す る角変位検出器の出力がずれてしまうため、これのオフ セツト調整が必要となる。

30 【0212】ここで、オフセツトの調整方法としては、 前述のように、初期調整において、マイコンからVAP センター基準位置保持信号を出力した状態で、VAPを 通過した光束が光学中心となるように調整を行う。これ は、VAPセンター基準位置保持信号にオフセツトを付 加する事によっても実現できるが、素子、メカ構造に起 因するオフセツトのばらつきの大きさによって、調整範 囲を大きく取らねばならず、ひいてはダイナミツクレン ジの低下につながってしまう。また、高分解能のD/A 変換器を使用すれば良いが、これは高価である。

【0213】そこで、図2に示すように、外付けの安価 な、またはワンチツブマイコンに内蔵された低分解能D /A変換器25と、VAP駆動信号へのオフセツト付加 を組み合わせる。

【0214】つまり、安価な低分解能D/A変換器で粗 調整を行い、ぶれ制御信号のオフセツトにより微調整を 行う。

【0215】また、マイコン20で、これら2つの調整 手段をコントロールすることにより、調整時には意識し なくともよい。これにより、調整範囲が広く、且つ、高 [0216] またVAPの光学偏光位置信号の測定手段は、レーザー等によるVAPの通過光をPSD等でうけて測定する方法がある。

【0217】次に、この実施例におけるマイコン上の処理につていて、図17のフローチヤートにより説明する。

【0218】 (オフセツト調整) 処理をスタートし、ステップS401で、VAP光学中心位置信号 dとVAP 光空偏光位置信号 e (垂直に入射された光の中心位置からの偏光変位信号) とを比較し、差が0であればステッ 10 プS402へ、0でなければステップS406へ進む。 [0219] ステップS402では、安価な低分解能D/A変換器により粗測整を行う。すなわち図2のD/A変換器により粗測整を行う。すなわち図2のD/A変換器4によって角変位エンコーダ4eの値に所定のパイアスをかけ、大まかなVAPの基準位置調整を行

【0220】ステツプS403では、VAP光学中心位置信号dとVAP光学幅光位置信号の差が所定値f以下であれば、ステツプS404へ進む。ここで、fは低分解能D/A変換器の調整限界値に設定された値である。

[0221] ステップS404では、マイコン20から VAP駆動回路4へと供給されるVAP博神信号へのオ フセツト付加による微調整を行う。ここでの微調態は位 相/利得補正手段204よりぶれ補正プロツク30へと 供給されるぶれ補正のロントロール信号のレベルを微 調整することはつて高速度に行われる。

【0222】ステツブS405では、VAP光学中心位 置信号 dとVAP光学幅光位置信号 (垂直に入射され た光の中心位置からの偏光変位信号)とを比較し、両者 30 の差 | d - e | が0であればステツブS406へ進んで オフセツト調整動作を終了し、ステツブS406でな ければステツブS404へと戻る。ステツブS406 は、調整動作の終了を登味する。

【0223】ここでは、一軸の調整しか述べていないが、図14に示す双眼鏡では、左右、YAW、PITCHの合わせて4軸の調整が必要である。

【0224】サーボ機構により制縛されるVAPユニットを用いたぶれ補正核歴では、温度、経時変化、姿勢差による、軸摩擦、素子の変形等の機械的劣化により、基 40 準位置保持信号を加えた場合の光束の偏光が期待されるものに対し、オフセツトを持つ。単体では問題にならないレベルであるが、双眼鏡用として2組で使用する場合には、光軸のズレが観察者に不快感を与え兼ねなくなる。

[0225] そこで、本実施例では、キヤリブレーション時、あるいは、ぶれ植工動作中に、明らかに左右各々の信号がオフセツトを生じている場合に、左右の信号が一致するように補正を行う。これにより、左右光軸の一致した良好な観察が可能となる。

[0226]

「発明の効果」以上述べたように、本額の前求項1,2 に記載の発明によれば、ぶれを検出するぶれ検出手段 と、前記ぶれ検出手段の出力に基づいて、ぶれによる個 像の動きを補正する動き補正手段と、所定の駆動信号に 対する前記動き補正手段の応答特性を検出し、での検出 結果に基づいて前記動き補正手段の駆動特性を補正する 制御手段とを備えることにより、ぶれ補正手段の応答特 性が検出され、理想的な周波数特性に対する実際の応答 特性のずれが補正され、温度、経時変化による軸摩抹、 案子の変形等の機械的誤差に起因する特性変化を補正す ることができ、個体差のない最適特性を得ることができ る。

[0227] また光軸の偏光を機械的駆動により行うぶれ補正装置が比較的不得意とする10Hz以上でも、より良好な補正が可能となる。

[0228] また本額の請求項3に記載の発明によれば、動者補正手段の応答振備及び位相ずれを使出し、この応答振幅及び位相ずれに応じて、前記動き検出手段及20 び前記動き補正手段からなる制御系の伝達の利得及び位相ずれを補正したので、温度、経時変化による軸摩擦、業子の変形等の機械的觀察に起因する周波数体性変化を補正することができ、個体差のない最適特性を得ることができる。

【0229】また本願の請求項4、5に記載の発明によれば、前記動き補正手段の駆動範囲及び初期状態に相当 する基準位置に対するオフセツトを検出して、これを補 正するようにしたので、製造解禁、温度、経時変化による軸摩擦、素子の変形等の機械的誤差に起因する駆動範 囲のばらつきが抑えられて最適化が図られるとともに動 き補正の偏りが補正され、補正ダイナミツクレンジを広 くとることができる。

[0230] また本願の請求項6に配載された発明によれば、可変預角プリズムの温度、経時変化、素子の変形等の機械的誤差による緊動特性の劣化及び変化が良好に相下され、最適制御を図ることができる。

【0231】また本願の請求項7、8 に記載された発明 によれば、動き補正手段の駆動特性の検出、補正動作 を、動き補正手段の動作、非動作の切り娘え時、パツテ リーチエツク時等の撮影中でないときにいにタイミング 良く行うことができ、撮影動作を妨げず、駆動特性の補 正を行うことが可能となる。

【0232】また本類の請求項9に記載された発明によれば、前記ぶれ補正数据の接限部を操作者が観察しているときには動き補正手段の駆動特性の検出及び補正動作を禁止したので、撮影動作を妨げることがなく、常に良好な撮影を行うことが可能となる。

【0233】また本願の請求項10,11に記載の発明 によれば、ぶれ補正手段の所定のテスト用の駆動信号に 50 対する応答特性のオフセツトを検出して、その伝達特性

を補正するとともに、このオフセツト情報を記憶して以 後の制御に用いるので、常に動き補正手段の動作を最適 な特性で行われ、温度、経時変化による軸摩擦、素子の 変形等の機械的誤差に記因する特性変化が補償される。

【0234】また本願の請求項12に記載の発明によれ ば、動き補正手段の応答振幅及び位相ずれを検出し、こ の応答振幅及び位相ずれに応じて、前記動き検出手段及 び前記動き補正手段からなる制御系の伝達の利得及び位 相ずれを補正したので、温度、経時変化による軸摩擦、

素子の変形等の機械的調差に起因する周波数特性変化を 10 視図である。 補正することができ、個体差のない最適特性を得ること ができる。

【0235】また本願の請求項13、14に記載の発明 によれば、前記動き補正手段の駆動限界範囲及び初期状 能に相当する基準位置に対するオフセットを輸出して、 これを補正するようにしたので、製造誤差、温度、経時 変化による軸摩擦、素子の変形等の機械的誤差に起因す る駆動範囲のばらつきが抑えられて最適化が図られると ともに動き補正の偏りが補正され、補正ダイナミツクレ

【0236】また各請求項の発明によれば、ぶれ補正手 段に光軸調整に価格の安い低分解能D/A変換器を使用 しても、入力角速度信号に対して、ダイナミツクレンジ の確保と、高分解能を両立することが可能となる。

【図面の簡単な説明】 【図1】第1の実施例を示すプロツク図である。

ンジを広くとることができる。

【図2】図1の実施例の要部の構成(キヤリブレーショ ンプロツク及びぶれ補正プロツク)を示すプロツク図で

【図3】図2の構成で行われるキヤリブレーション動作 30 8 バツテリーチエツクスイツチ

を説明するための図である。 【図4】第1の実施例の動作を説明するためのフローチ

ヤートである。 【図5】 VAPを組み込んだ撮影光学系の一例の構成を

示す図である。 【図6】 VAPの駆動回路の基本構成を示すプロツク図

である。 【図7】 VAPを用いたぶれ補正系の制御動作を説明す

るためのフローチヤートである。 【図8】本発明の実施例を説明するためのVAPの構造 40 206 周波数/振幅検出手段

図である。

【図9】本発明の実施例を説明するためのVAPの構造 図である。

98 【図10】本発明の実施例を説明するためのVAPユニ ツトの周波数特性を示す図である。

【図11】本発明の実施例におけるHPF、積分手段、 利得/位相補正手段等を構成するデジタルフイルタの構 成を示す図である。

【図12】観察者がフアインダ接眼部を覗いているか否 かを検知する観察者検知手段の構成を説明するための図 である.

【図13】本発明のぶれ補正装置を内蔵した双眼鏡の斜

【図14】本発明のぶれ補正装置を内蔵した双眼鏡の透 視図である。

【図15】本発明における第2の実施例を示すフローチ ヤートである。

【図16】本発明における第3の実施例を示すフローチ ヤートである。

【図17】本発明における第4の実施例を示すフローチ ヤートである。

【図18】第2の実施例~第4の実施例に共通する双眼 20 鏡のぶれ検出及び補正系の構成を示すプロツク図であ Ά.

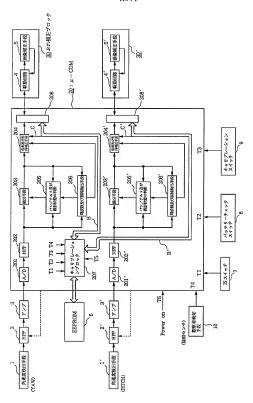
【符号の説明】

1 角速度検出手段(角速度センサ)

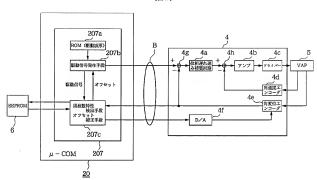
- 2 HPF
- 3 アンプ
- 4 駆動回路
- 5 画像補正手段(ぶれ補正手段)
  - 6 EEPROM
- 7 ISスイツチ
- 9 キヤリプレーションスイツチ
  - 20 マイコン
  - 30 ぶれ補正プロツク
  - 106 VAP
  - 201 A/D変換器
  - 202 HPF
  - 203 積分手段
  - 204 位相/利得補正手段
  - 205 パン/チルト判別手段

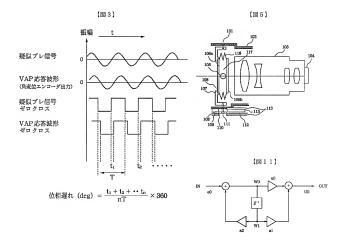
  - 207 キヤリプレーションブロツク
  - 208 切換プロツク
  - 400 双眼鏡

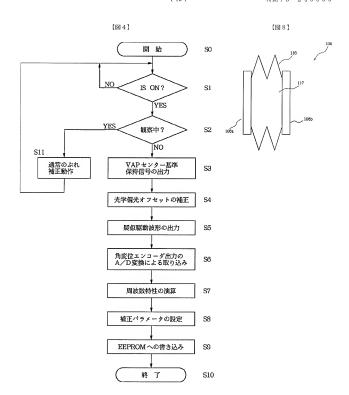
[図1]

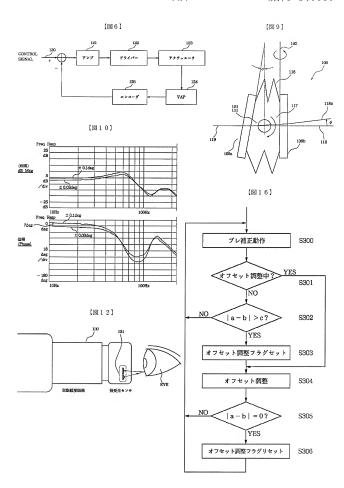


[図2]

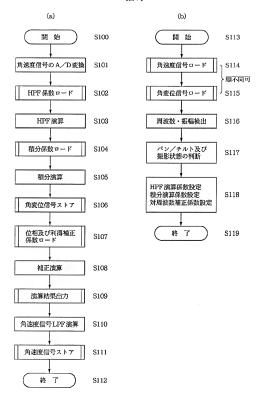




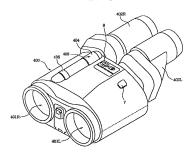




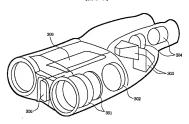
[図7]



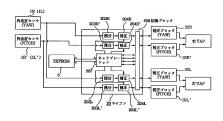
[図13]



[図14]



[図18]



【図15】

